

# FUJITSU PLMソリューション 分析事例の紹介と所有分析装置

試作品が設計通りにできているか？ 工程やフィールドで発生したトラブルの原因は？  
部品や材料で知りたいこと、困ったことに分析技術でお応えします。

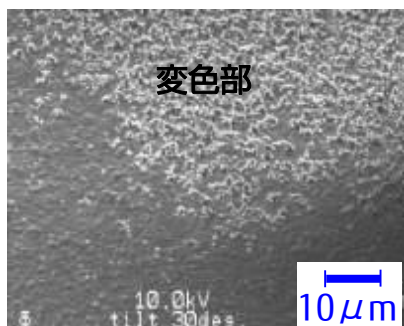
## 特徴

目的・ご予算に応じた最適な分析手法をご提案いたします

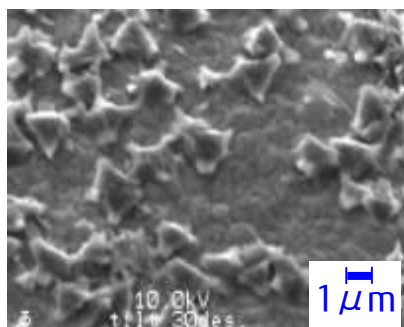
分析結果だけでなく、原因究明、対策案提示も行います

立会分析・日時指定分析にも対応いたします

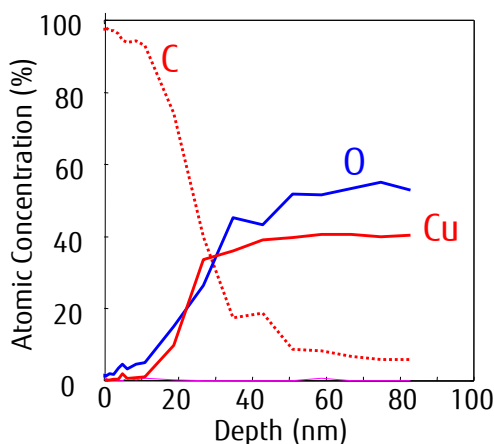
## 分析事例1 プリント板 金パッド変色原因調査



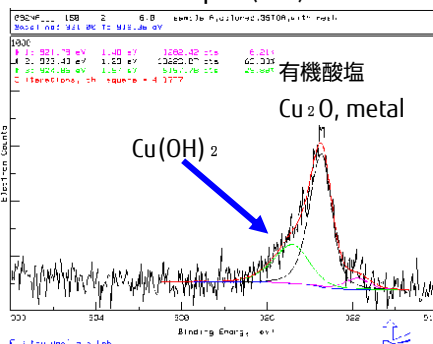
↓ 拡大



走査型電子顕微鏡観察  
変色部には数μm大の付着物がある



オージェ電子分光分析  
付着物は銅の酸化物  
表面に多量の炭素が存在

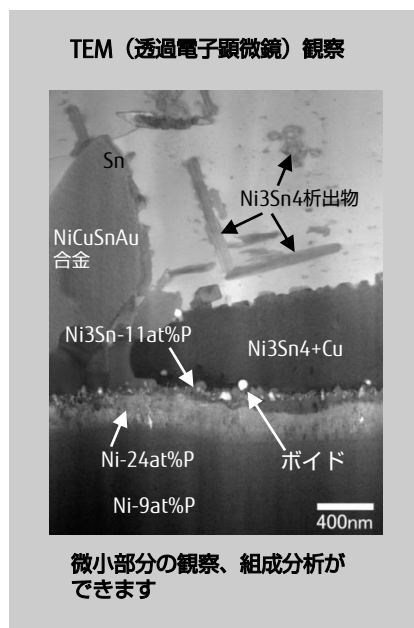
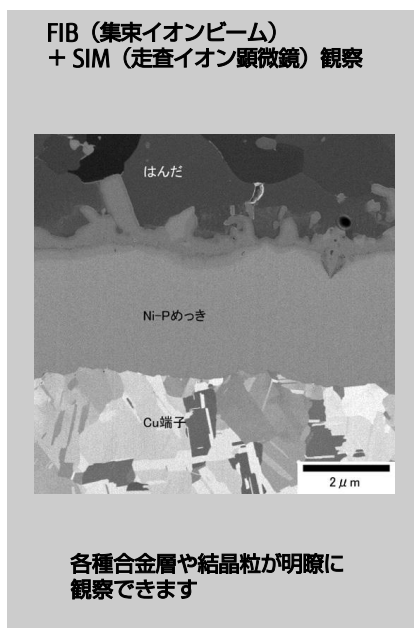
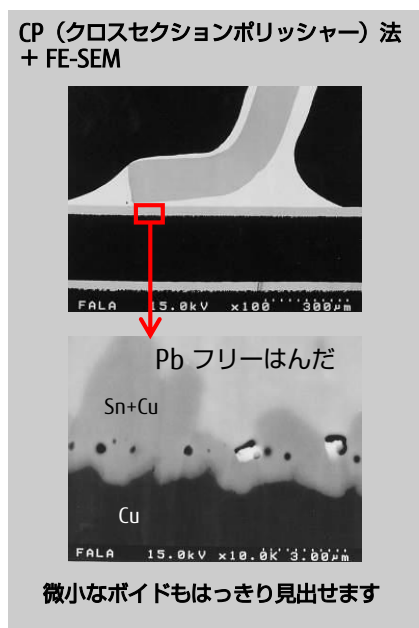


X線光電子分光分析  
銅は主に有機酸塩の状態  
表面の炭素は窒素と酸素を  
含む有機物

→ 有機酸処理後の洗浄が不十分であったことが判明

## 分析事例2 各種断面観察

お知りになりたい内容・材料に応じて最適な分析手法をご提案いたします。



## 主な分析装置

形態/構造分析	走査型電子顕微鏡 (SEM)
	集束イオンビーム加工・観察装置 (FIB-SIM)
	アルゴンイオン断面加工装置 (CP (クロスセクションポリッシャー) )
	透過型電子顕微鏡 (200kV-FE-TEM, STEM-EDX, EELS付き)
表面分析	X線光電子分光装置 (マイクロXPS)
	走査型オージェ電子分光装置 (AES)
	電子線マイクロアナライザ (WDX-EPMA, EDX-EPMA)
元素分析	誘導結合プラズマ発光分光分析装置 (ICP-AES)
	誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICP-MS)
	蛍光X線分析装置 (XRF)
	イオンクロマトグラフ分析装置 (IC)
熱分析	示差走査熱量計 (DSC)
	動的粘弾性測定装置 (DMS)
	熱機械分析装置 (TMA)
有機分析	ガスクロマトグラフ質量分析装置 (GC-MS)
	フーリエ変換赤外分光分析装置 (FT-IR)

## 富士通クオリティ・ラボ株式会社

材料分析、物性特性分析

本社事業所 Tel : 044-280-9948 Fax : 044-587-5080

(9時~17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

URL : <http://www.fujitsu.com/jp/group/fql/contact/analysis/>

E-mail : [fql-analysis@cs.jp.fujitsu.com](mailto:fql-analysis@cs.jp.fujitsu.com)